ЛАЗЕРЫ

PACS 42.55.Vc; 42.65.Re; 52.38.Ph

Субпикосекундный рентгеновский лазер с λ = 41.8 нм в плазме, образованной при взаимодействии фемтосекундной лазерной накачки с потоком кластеров ксенона

Е.П.Иванова

Проведен модельный расчет коэффициента усиления спонтанного излучения на переходе 4d5d (J = 0) - 4d5p (J = 1) cдлиной волны 41.8 нм в Pd-подобном ионе ксенона в плазме, образованной при взаимодействии фемтосекундной лазерной накачки с потоком кластеров ксенона. Обсуждены условия создания рентгеновского лазера с ультракороткой (~1 nc) длительностью импульсаы.

Ключевые слова: моделирование рентгеновских лазеров, атомно-кинетический расчет, Pd-подобный ион ксенона.

1. Введение

В настоящее время ведется интенсивный поиск путей получения голографических дифракционных изображений с высоким пространственно-временным разрешением для визуализации быстро изменяющихся нанообъектов. Так, современные рентгеновские лазеры (РЛ) на свободных электронах с длиной волны излучения λ = 1–10 нм и длительностью импульса $t_{\text{las}} = 15 \text{ фс позволяют}$ регистрировать голографические изображения промежуточных состояний нанообъектов за время, сопоставимое с временем атомных движений [1,2]. В работах [1,2] показана возможность наблюдения динамики фазовых переходов в твердых телах: образования трещин, зарождения фаз и их разделения, быстрых флуктуаций в жидких телах и биологических клетках. Мощные РЛ с субпикосекундной длительностью импульса могут эффективно использоваться для диагностики очень быстро изменяющейся лазерной плазмы в области ее критической плотности.

Для многих применений возможно использование компактных РЛ с достаточно малыми длинами волн излучения и длительностью импульса менее 1 пс. Принципиальным требованием является получение изображений нанообъектов за один импульс, для чего необходимо, чтобы количество выходящих фотонов составляло не менее 10¹² в каждом импульсе РЛ.

Фундаментальные предпосылки для создания РЛ, генерирующих ультракороткие импульсы, были разработаны в [3–8], где для получения плазмы использовался лазерный предымпульс, за которым следовал ультракороткий импульс, создающий большую инверсию населенностей рабочих уровней. В данной схеме могут применяться импульсы от двух лазеров; однако наиболее эффективным оказалось использование импульса на частоте высокой гармоники (ВГ) с длиной волны, близкой к длине волны излучения РЛ (ВГ может быть образована при нелинейном преобразовании фемтосекундного лазерного излучения на переходе специально подобранного атомарного газа). Длительность выходного импульсного излучения РЛ определяется параметрами накачки и плотностью плазмы.

В 2002 г. с использованием сверхбыстрой стрик-камеры были выполнены измерения разрешенного во времени энергетического выхода излучения РЛ с $\lambda = 13.9$ нм на переходе 4d (J = 0) – 4p (J = 1) Ni-подобного иона серебра (Ag¹⁹⁺) [3]. При оптимальных условиях накачки временная ширина импульса РЛ на полувысоте была равна 1.9 ± 0.7 пс, а его энергия достигала 2-6 мкДж. Задержка между длинным предымпульсом (300 пс, ~10¹² Вт/см²) и основным импульсом (1.3 пс, 1.1×10^{15} Bt/см²) составила 200 пс. В [3] было установлено, что максимальный энергетический выход РЛ (E_{out}) достигался раньше, чем максимальная температура электронов плазмы. Исходя из этого факта, а также из результатов временных спектроскопических измерений, был сделан вывод о том, что затухание усиления происходило за счет ионизации рабочего иона Ag¹⁹⁺ в состояния с более высокой кратностью ионизации (Ag²⁰⁺, Ag²¹⁺ и т.д.).

В 2009 г. с использованием сверхбыстрой стрик-камеры временная ширина импульса РЛ была оценена в 1.13 ± 0.47 пс [9]. В [9] исследовался РЛ (λ = 32.6 нм) на Ne-подобном ионе титана, где рабочая среда создавалась тремя последовательными импульсами накачки: предымпульсом с энергией 10 мДж и длительностью 120 пс, следовавшим за ним через 5 нс вторым предымпульсом с энергией ~350 мДж (оба предымпульса фокусировались почти вдоль нормали к поверхности титановой мишени), и третьим разогревающим импульсом с энергией 0.9 Дж и длительностью 6.7 пс, направленным под углом скользящего падения 23°. В результате формировалась рабочая плазма для усиления на λ = 32.6 нм в Ne-подобном ионе титана, концентрация которой составляла ~10²⁰ см⁻³. Оставшаяся часть излучения Ті: сапфирового лазера использовалась для генерации излучения 25-й гармоники, которое направлялось в активную среду под углом 9°. Длина волны этой гармоники, генерировавшейся в газообразном аргоне, практически совпадает с рабочей длиной волны λ = 32.6 нм. Ее взаимодействие с излучением РЛ привело к значительному повышению когерентности излучения РЛ [9].

Е.П.Иванова. Институт спектроскопии РАН, Россия, Московская обл., 142190 Троицк, ул. Физическая, 5; e-mail: eivanova@isan.troitsk.ru

Поступила в редакцию 3 июля 2012 г., после доработки – 4 октября 2012 г.

Аналогичная схема использовалась в [6], где было достигнуто насыщение усиления на длине РЛ на Ni-подобных ионах молибдена ($\lambda = 18.9$ нм) и серебра ($\lambda = 13.9$ нм). Оба РЛ индуцировались ВГ на соответствующих длинах волн. Были получены интенсивные короткие импульсы излучения РЛ с чрезвычайно высокой пространственной когерентностью и малой расходимостью. Кроме того, благодаря малой спектральной ширине таких импульсов достигалось также сужение спектра импульса ВГ, т.е. улучшение его временной когерентности.

Принципиальная возможность достижения полной пространственной когерентности излучения РЛ с использованием импульса ВГ была продемонстрирована в [4]. Основная задача состояла в достижении высокого оптического качества пучка ВГ. Исследовался РЛ на переходе 4d (J = 0) – 4p (J = 1) Ni-подобного иона криптона с $\lambda = 32.8$ нм в плазме, образованной при ионизации оптическим полем (ИОП) газообразного криптона. Задержка импульса ВГ подбиралась такой, чтобы он фокусировался в рабочий объем плазмы в момент достижения в ней максимального усиления.

Образование плазмы методом ИОП происходит при продольной накачке мишени; в рабочей среде возникает большой градиент коэффициента преломления вследствие более низкой концентрации электронов у края плазмы. В связи с этим разрабатываются различные схемы волноводов в плазме РЛ для повышения ее однородности и уменьшения расходимости выходного коротковолнового излучения. Так, в работе [10] было достигнуто 400-кратное увеличение энергетического выхода излучения РЛ на ионах Kr IX с λ = 32.8 нм благодаря использованию аксикона для создания волновода.

В последние годы развивается новое направление исследований РЛ, основанное на ИОП потока кластеров криптона (Kr IX, λ = 32.8 нм [10, 11]) и ксенона (Xe IX, λ = 41.8 нм [12]). При этом не создавались РЛ с ультракоротким импульсом излучения, однако полученные результаты могут быть использованы для их разработки. Так, экспериментально [11] была разработана оригинальная схема, в которой при распространении усиленного спонтанного излучения KrIX с λ = 32.8 нм происходит его взаимодействие с излучением ВГ с той же длиной волны, распространяющейся в том же направлении. В [11] поток кластеров криптона формировался с помощью щелевого сопла, накачка плазмы проводилась облучением кластеров в направлении вдоль щели. Параметры плазмы были следующими: длина L = 8 мм, диаметр d = 25 мкм, концентрация ионов $n_i = 1.6 \times 10^{19} \text{ см}^{-3}$, концентрация электронов $n_{\rm e} \approx 10^{20}$ см⁻³. Накачка плазмы осуществлялась тремя последовательными импульсами Ті: сапфирового лазера (10 ТВт, 38 фс, 810 нм, 10 Гц). Первый импульс (235 мДж, 38 фс) с циркулярной поляризацией излучения использовался для подготовки методом ИОП плазмы, в которой доминируют рабочие ионы KrIX. Через 2.5 нс за ним следовали два других импульса - «воспламенитель» (45 мДж, 38 фс, линейная вертикальная поляризация) и «нагреватель» (270 мДж, 160 пс, линейная горизонтальная поляризация), которые использовались для формирования волновода в плазме. Временной интервал между ними составлял 200 пс. Для фокусировки излучения была разработана оптическая схема, включающая в себя аксикон для формирования волновода в плазме [10]. В созданном таким образом РЛ индуцировалось пространственно однородное распределение плотности плазмы. При этом длина волны 25-й гармоники излучения Ті: сапфирового лазера, генерировавшейся в потоке нейтрального аргона, с хорошей точностью совпадает с длиной волны излучения РЛ. Оптимальное время задержки импульса ВГ относительно начала генерации РЛ было равно 2 пс. Указанные параметры импульсов обеспечивали максимальный выход фотонов 10¹¹ фотон./имп. Использование 25-й гармоники привело к уменьшению расходимости излучения РЛ в 4.5 раза. При этом измерения пространственной когерентности с помощью двухщелевого интерферометра Юнга показали, что она повысилась в ~4 раза. Использование ВГ увеличивало выход фотонов на 10%.

Стимуляция излучения РЛ при резонансном взаимодействии ВГ фемтосекундного лазерного излучения с инвертированным рабочим переходом является уникальным инструментом для измерения времени существования усиления в РЛ. Этот метод был продемонстрирован в [13], где разработана процедура измерения коэффициента усиления излучения РЛ как функции времени. При изменении задержки между моментом формирования среды РЛ и приходом импульса ВГ можно проследить эволюцию коэффициента усиления для РЛ с временным разрешением в несколько фемтосекунд. В [13] измерены зависящие от времени факторы усиления в Xe⁸⁺ (Pd-подобный ион ксенона, $\lambda = 41.8$ нм). Плазма создавалась методом ИОП газообразного ксенона. Временные зависимости коэффициентов усиления приведены для давлений газообразного ксенона 5-25 Тор (рис.2-4 в [13]); при этом время существования усиления в РЛ уменьшалось от 34.1 до 5.5 пс.

Развитая в [13] методика эффективна для проверки теоретических моделей и погрешностей значений используемых атомных данных. Результаты этой работы хорошо согласуются с результатами наших расчетов временной эволюции коэффициента усиления в Xe⁸⁺, которые были выполнены в [14,15] до проведения эксперимента [13]. Из наших расчетов [14–17] следует, что затухание усиления для РЛ обусловлено ионизацией Xe⁸⁺ в состояния с более высокой кратностью ионизации (Xe⁹⁺, Xe¹⁰⁺). Длительность импульса излучения РЛ уменьшается с увеличением концентрации электронов как ~1/n_e, что также подтверждается экспериментом [13].

Заметим, что резонансное взаимодействие ВГ с излучением рабочего перехода в РЛ может приводить к увеличению ее интенсивности. Так, в эксперименте [6] измерялись параметры излучения РЛ (λ =13.9 нм) на Ni-подобном ионе серебра. Повышение когерентности излучения РЛ с λ =13.9 нм индуцировалось 59-й гармоникой Ti: сапфирового лазера, полученной в неоне, энергетический выход которой также измерялся. В [6] было зарегистрировано 400-кратное увеличение энергии импульса ВГ (до 75 нДж) после взаимодействия с излучением РЛ.

Идея создания РЛ с ультракороткой длительностью импульса основывается на том, что с увеличением концентрации электронов длительность этого импульса становится меньше 1 пс. При этом среднее значение коэффициента усиления может составлять несколько сотен обратных сантиметров, так что произведение gL (g – усредненный по времени коэффициент усиления, L – длина плазменного шнура) будет достаточным для того, чтобы обеспечить высокий квантовый выход фотонов РЛ уже при $L \approx 300$ мкм. Увеличение концентрации электронов приводит к увеличению скорости возбуждения верхнего рабочего уровня, инверсии и коэффициента усиления, при этом увеличивается и скорость ионизации рабочего иона. С другой стороны, с увеличением плотности плазмы усиливается реабсорбция фотонов на нижний рабочий уровень, поэтому скорость его опустошения уменьшается, что приводит к уменьшению (исчезновению) инверсии.

В настоящей работе рассчитывается энергетический выход для РЛ на ионах Xe⁸⁺ при различных параметрах плазмы с целью определения оптимальных схем РЛ с субпикосекундной длительностью импульса. Предлагаемая схема основана на использовании одного импульса накачки, аксикона и ВГ. Заметим, что схемы РЛ в описанных выше экспериментах [3–8] имеют весьма низкую эффективность вследствие использования, как правило, нескольких предымпульсов накачки с большой энергтей.

2. Предпосылки для создания РЛ с ультракороткой длительностью импульса в плазме, образованной при взаимодействии лазерной накачки с потоком кластеров ксенона

Перспектива создания РЛ с субпикосекундной длительностью импульса обусловлена, прежде всего, аномально большим сечением возбуждения верхнего рабочего уровня 4d5d (J = 0) в Xe⁸⁺. Зависимость скорости возбуждения этого уровня электронным ударом от температуры приведена в нашей работе [16]. Эта скорость примерно на три порядка превышает скорости возбуждения верхнего рабочего уровня 2p⁵3p (J = 0) Ne-подобного иона аргона (Ar⁸⁺).

В первом эксперименте по созданию РЛ на ионах Xe⁸⁺ были получены большие значения произведения gL (~10) и длительности импульсов $t_{las} \ge 20$ пс [18]. Накачка плазмы проводилась ИОП газообразного ксенона в кювете. Еще бо́льшие значения gL были достигнуты в последующих аналогичных экспериментах [19].

В эксперименте [12] при использовании щелевого сопла для формирования потока кластеров и накачки единственным импульсом (без предымпульса) наблюдалось интенсивное излучение на $\lambda = 41.8$ нм. Для накачки плазмы методом ИОП применялась Ті: сапфировая лазерная система (10 ТВт, 55 фс, 810 нм). Ширина фокального пятна на полувысоте составляла 25 мкм, в нем содержалось 85% энергии накачки. Пиковая интенсивность $I_{\text{pump}}^{\text{max}} = 7 \times 10^{17}$ Вт/см² при энергии накачки 350 мДж. Длина плазмы – диаметр потока кластеров – была фиксирована: L = 1.7 мм. Максимальный выход (95 × 10⁻⁹ Дж) наблюдался при $n_i = 7.5 \times 10^{17}$ см⁻³ и $n_e \approx 6 \times 10^{18}$ см⁻³ (см. рис.3 в [12]).

Импульсы излучения РЛ были зарегистрированы при атомной концентрации, изменяющейся в 300 раз: $1.1 \times 10^{17} \le n_i \le 3.3 \times 10^{19}$ см⁻³. Давление ксенона в камере изменялось в диапазоне 0.013–4 МПа (0.13–40 атм), а средний размер кластера при этом увеличивался от 50 до 500 Å.

Приведем основные предпосылки для создания РЛ на потоках кластеров:

 – Возможность более чем 90%-ного поглощения энергии накачки; это было показано, например, в эксперименте [20] для потоков кластеров благородных газов при пиковой интенсивности накачки менее 10¹⁷ Вт/см².

Слабое отражение пучка накачки от потока кластеров и отсутствие осколков в плазме.

– Возможность достижения энергий электронов в несколько килоэлектронвольт [21]. В других ранних экспериментах [22] было установлено, что высокие температуры электронов *T*_e достигаются при облучении достаточно больших кластеров: $T_{\rm e} > 1$ кэВ при диаметре кластера 150 Å и интенсивности ~10¹⁶ Вт/см², а $T_{\rm e} ~ 10$ кэВ при повышении интенсивности до 5 × 10¹⁶ Вт/см² (см. рис.9 в [22]).

– Возможность контроля плотности и температуры плазмы, а также ионизационного баланса.

 – При высокой скорости потока кластеров частота следования импульсов РЛ может составлять ~125 кГц [23].

Большое число параметров, характеризующих а) плазму и ее геометрию, б) сопло, давление в камере с газом и размер кластеров, в) импульс лазерной накачки, должно быть согласовано с помощью теоретической модели. Тогда активная среда может быть создана одним основным импульсом накачки. Это возможно, если модель адекватно воспроизводит результаты эксперимента.

В работе [16] была выполнена интерпретация экспериментальных результатов [12] с целью определения электронной температуры для каждой экспериментальной атомной концентрации; величина T_e подбиралась такой, чтобы воспроизвести экспериментальную кривую на рис.3 в [12]. Определенная таким образом зависимость T_e от концентрации приведена в [16] на рис.4, из которого видно, что при увеличении атомной концентрации от 10^{17} до 8×10^{18} см⁻³ температура T_e увеличивалась от 300 до 1000 эВ. При более высоких концентрациях выход для РЛ был слишком мал [12].

Размер кластера имеет важнейшее значение для образования высокотемпературной плазмы при взаимодействии ультракороткого импульса накачки с потоком кластеров. Длительность пьедестала импульса обычно составляет несколько наносекунд; в процессе взаимодействия пьедестала импульса с кластером происходят разогревание, вылет электронов с поверхности и расширение кластера. Наибольшее значение Те достигается, когда в наноплазме кластера $n_{\rm e} = 3n_{\rm cr} (n_{\rm cr} = \pi c^2 m_{\rm e}/(e^2 \lambda^2));$ при этом происходит резонансный вклад энергии в плазму [20-22]. Для достижения максимального энерговклада длительность и интенсивность пьедестала должны соответствовать размеру кластера: если кластер слишком маленький (быстро расширяется до $n_{\rm e} \sim 3 n_{\rm cr}$), его развал происходит слишком быстро (до прихода основного интенсивного импульса) и температура Те невысока. Если кластер слишком большой (расширяется слишком долго), его развал происходит после прохождения интенсивного импульса и температура Те также невысока. Для кластера нужного размера n_e достигает 3n_{cr} в момент прихода основного фемтосекундного импульса, в этом случае T_e имеет максимальное значение.

Зависимости размеров кластеров от давления и температуры газа в исходной камере, а также от геометрии клапана, хорошо изучены для конусообразных клапанов с круглым отверстием, для которых количество атомов в кластерах благородных газов обычно определяется методом рэлеевского рассеяния с использованием эмпирической формулы [24]. Недавно начались исследования зависимости размеров кластеров от давления газа в исходной камере для щелевого сопла. Так, в [25] показано, что щелевое сверхзвуковое сопло обеспечивает значительно более высокое число атомов в кластере по сравнению с конусообразным соплом. Это обстоятельство объясняет полученный в [12] интенсивный импульс РЛ при использовании одиночного импульса накачки и щелевого сопла.

Зависимости энергий электронов и ионов плазмы от размера кластера исследовались во многих экспериментальных работах, например в [21, 26]. В [21] поток класте-



Рис.1. Зависимость температуры электронов T_e в плазме от концентрации Xe⁸⁺ (n_i). Начальная часть кривой, до $n_i \sim 6 \times 10^{18}$ см⁻³, рассчитана в [16], остальная часть определена с использованием экспериментальных и теоретических данных работы [26]. На вставке – зависимость температуры электронов в плазме от количества атомов N в кластере (от размера кластера).

ров ксенона облучался лазерным излучением с пиковой интенсивностью 10¹⁶ Вт/см². В этой работе показано, что кластеризация атомов ксенона с повышением давления в исходной камере начинается при давлении ~1 бар. С увеличением давления размер кластера увеличивается, что приводит к быстрому увеличению электронной температуры плазмы (см. рис.2 в [21]). Зависимость T_е от концентрации качественно совпадает с полученной в [16]. Для экстраполяции этой зависимости в область больших концентраций ионов плазмы ($n_i \ge 10^{18}$ см⁻³, что соответствует размеру кластеров не менее 10³ атом./кластер) воспользуемся рис.4 из работы [26]. Получающаяся при этом зависимость T_e от n_i показана на рис.1. На вставке к рис.1 представлена соответствующая зависимость T_e от размера кластера. Эта зависимость будет использована нами при расчете коэффициента усиления g(t).

3. Субпикосекундный лазер с $\lambda = 41.8$ нм на ионах Xe⁸⁺

Модель для расчета генерации РЛ использовалась в наших предыдущих работах [14-17], где приведены ссылки на детальное описание теоретического подхода. В расчетах полагалось, что плазма – однородный цилиндр диаметром d = 25 мкм, а T_e и T_i постоянны в процессе усиления (*T*_i-температура ионов). Концентрация Pd-подобных ионов ксенона Xe⁸⁺ сразу после ИОП составляет 0.9 от полного числа ионов n_i при интенсивности лазерного излучения накачки 10¹⁶-10¹⁷ Вт/см² [18]. В [18] было установлено, что в результате туннельной ионизации атома ксенона происходит отрыв внешних 51-электронов и практически 100% ионов оказываются в состоянии с заполненной оболочкой 4d¹⁰. В нашей работе [16] концентрация ионов Xe8+ в начальный момент времени определялась по экспериментальным зависимостям квантовых выходов от длины плазменного шнура [18, 19]. Кроме того, в [16] определялся также эффективный диаметр плазмы. Расчеты [16] показали, что начальная концентрация Хе⁸⁺ в экспериментах [18, 19] составляла ~0.9 и 0.85 соответственно. ИОП газообразной мишени обеспечивает низкую температуру ионов T_i [13, 18, 19], так что ее влияние на ширину линии лазерного перехода ничтожно мало; в этом случае T_е может быть равна 100-300 эВ [13, 18, 19]. При использовании потока кластеров в качестве мишени плазма нагревается в результате взрыва ионизованного кластера; в начальный момент после взрыва $T_i > T_e$, однако термализация электрон-ионных компонентов при высокой концентрации плазмы ($n_i \ge 10^{19}$ см⁻³) происходит за время, не превышающее 100 фс. Поэтому в настоящем расчете мы полагаем $T_e = T_i$; это условие существенно сказывается на доплеровском вкладе в ширину линии лазерного перехода; тем не менее при высоких концентрациях ($n_i \ge 10^{19}$ см⁻³) уширение линий, обусловленное электронионными столкновениями, превышает доплеровское.

Для сопоставления результатов нашего расчета g(t) с результатами эксперимента [13], где плазма создавалась методом ИОП атомарного ксенона в кювете, приведен рис.2. На нем показаны зависимости от времени коэффициентов усиления *g* для линии с $\lambda = 41.8$ нм в Xe⁸⁺. Расчет, как и эксперимент [13], выполнен для $T_e = 300$ эВ и различных давлений атомарного газа ксенона ($T_{\rm i} \ll T_{\rm e}$). В нашем расчете диаметр плазмы *d* = 25 мкм, при этом его изменение в пределах 20-50 мкм существенно не влияет на результат. Сопоставление рис.2, а настоящей работы с рис.4 из [13] показывает очень близкое совпадение длительностей импульсов, максимальных значений g(t), а также формы кривых. Предварительные расчеты g(t)были представлены нами в [15]. Приведенные результаты подтверждают наш вывод о длительности t_{las} импульса излучения РЛ, сделанный в наших предыдущих работах [14-17]: t_{las} уменьшается с увеличением концентрации плазмы как $\sim 1/n_{\rm i}$.



Рис.2. Временные зависимости коэффициентов усиления на переходе иона Xe⁸⁺ с λ = 41.8 нм в плазме, образованной методом ИОП газообразного ксенона, при T_e = 300 эВ, давлениях газа 5, 10, 15, 20 и 25 Тор и концентрациях ионов n_i = 1.75 × 10¹⁸, 3.5 × 10¹⁸, 5.25 × 10¹⁸, 7.0 × 10¹⁸ и 8.25 × 10¹⁸ см⁻³ соответственно (*a*), а также в плазме, образованной методом ИОП в потоке кластеров ксенона, при тех же давлениях и электронных температурах T_e = 300, 350, 450, 600 и 750 эВ соответственно (*b*).



Рис.3. Временные зависимости коэффициентов усиления (*a*) и зависимости от длины плазмы выхода фотонов (*б*) для РЛ с λ = 41.8 нм и ультракороткой длительностью импульса при различных концентрациях n_i и температурах T_e .

На рис.2, б показаны результаты аналогичного расчета величин g(t), выполненного при тех же атомных концентрациях, что и для рис.2, а, однако здесь предполагается, что плазма образована в результате ИОП потока кластеров ксенона. Температура Т_е определяется согласно рис.1, а $T_i = T_e$. Изменения в виде зависимостей на рис.2,6 по сравнению с зависимостями на рис.2, а обусловлены двумя факторами: увеличением ширины линии за счет усиления доплеровского эффекта и увеличением инверсии населенностей и коэффициента усиления за счет увеличения T_e с ростом *n*_i. При малых концентрациях плазмы (*n*_i ≤ 10¹⁸ см⁻³, $T_{\rm e} ≤ 1000$ эВ) превалирует эффект уширения линии, поэтому зависимость g(t) лежит ниже соответствующих кривых на рис.2, *a*. При больших концентрациях ($n_i \ge n_i$ 5 × 10¹⁸ см⁻³, $T_{\rm e} \ge$ 5000 эВ) превалирует эффект быстрого заселения верхнего рабочего уровня, в результате чего коэффициент g(t) в максимуме превышает соответствующие значения на рис.2,а.

Зависимости, приведенные на рис.3, а, рассчитаны для плазмы с высокой концентрацией ((6.25-43.75) × 10^{18} см⁻³, $T_{\rm e} = 4 - 8 \, \text{к} \Rightarrow \mathbf{B}$) в предположении ультракороткого импульса накачки ($t_{pump} < 100 \text{ фс}$). Видно, что при $n_i \ge 3 \times 10^{19}$ cm^{-3} время затухания равно ~1 пс, а длина мишени L может составлять ~300 мкм; это обусловлено энергией и условиями накачки, а также желаемым t_{las}. Квантовые выходы фотонов с $\lambda = 41.8$ нм ($N_{\text{out}}^{\text{ph}}$) в зависимости от длины мишени представлены на рис.3, б. Заметим, что все кривые выходят на постоянные асимптотики, поскольку радиационные потери при столь малых временах не учитываются. Параметры плазмы, соответствующие максимальному выходу $N_{\rm out}^{\rm ph} \approx 1.7 \times 10^{13}$ фотон./имп. при $t_{\rm las} \approx 1$ пс таковы: $L \approx 300$ мкм, $n_{\rm i} = 2.5 \times 10^{19}$ см⁻³, $T_{\rm e} = 8$ кэВ. На рис.4 показаны зависимости от n_i выхода фотонов N_{out}^{ph} за время 1 пс из объема плазмы $V = \pi (d/2)^2 L \approx 1.5 \times 10^{-8} \text{ см}^3$. Видно, что оптимальные условия для субпикосекундного лазера при использовании метода ИОП кластеров ксенона соответствуют довольно узкому диапазону атомных концентраций: (2.25-2.75) × 10¹⁹ см⁻³.

Очевидно, что для отсечения послесвечения через 1 пс после начала генерации излучения с $\lambda = 41.8$ нм необходимо разработать затвор на выходе из плазмы.



Рис.4. Квантовый выход для РЛ с длительностью импульса ~1 пс в зависимости от концентрации ионов.

4. Заключение

Выполнение трех принципиальных условий лежит в основе схемы РЛ на Xe^{8+} с ультракороткой длительностью импульса при $\lambda = 41.8$ нм: быстрое возбуждение верхнего рабочего уровня $4d^95d$ (J = 0) из основного состояния $4d^{10}$; быстрая ионизация Xe^{8+} в состояния с более высокими кратностями ионизации (Xe^{9+} , Xe^{10+}); большой коэффициент усиления g, усредненный на временном интервале 1 пс.

Ионизационный баланс определяется интенсивностью излучения лазера накачки; так, для получения плазмы, в которой доминируют ионы Xe⁸⁺, достаточна интенсивность $10^{16}-10^{17}$ Вт/см². Обычные фемтосекундные лазеры генерируют предымпульс длительностью несколько наносекунд, которая должна быть коррелирована с размером кластера для достижения максимального энерговклада основного фемтосекундного импульса. Для получения высокотемпературной плазмы средний размер кластеров должен быть равен ~500 Å, такой кластер содержит не менее 5×10^4 атом./кластер [26]. Наиболее эффективный способ формирования кластеров большого размера – использование щелевого сверхзвукового сопла [25] с шириной щели 500 мкм; поперечное сечение потока кла-

стеров имеет форму прямоугольника. Заметим, что в настоящее время разрабатываются способы дополнительного разогрева плазмы кластера во время его расширения с использованием вспомогательных импульсов [27]. Распределение кластеров по размеру, и доля атомарного ксенона в потоке кластеров представляют собой отдельную проблему. Распределение кластеров по размеру нельзя оценить методом рэлеевского рассеяния [24, 25]. В нашем расчете мы полагаемся на многочисленные экспериментальные зависимости температуры электронов плазмы от условий эксперимента.

В обсуждаемом подходе пучок лазерного излучения накачки должен быть направлен перпендикулярно щели, так чтобы длина плазмы $L \approx 300$ мкм. Для объема плазмы $\sim 10^{-8}$ см³ величина $N_{out}^{ph} \sim 10^{13}$ фотон./имп. может быть достигнута при $n_i = (2-3) \times 10^{19}$ см⁻³ (см. рис.3,6 при $L \sim 300$ мкм) и энергии импульса накачки $\sim 10-20$ мДж.

Достоверность полученных нами коэффициентов усиления g(t) при различных параметрах плазмы и, как следствие, достоверность оценки квантового выхода РЛ подтверждаются сопоставлением с результатами соответствующих экспериментальных измерений временной эволюции g(t) [13]. Заметим, что частично эти данные были представлены в нашей более ранней работе [15].

РЛ на Xe⁸⁺ с λ = 41.8 нм при указанных размерах кластеров и плотностях плазмы был описан в самом первом эксперименте по созданию РЛ в плазме, образованной в потоке кластеров лазерной накачкой [12]. Однако в моноимпульсной схеме этой работы не использовались ни аксикон, ни ВГ, так что плазма была существенно неоднородна вдоль радиуса. Лазерный пучок накачки и излучение РЛ сильно дефокусировались при распространении в плазме достаточно большой длины (L = 1.7 мм). Энергия РЛ расходовалась на нагрев прилегающих к плазме слоев кластеров. Это можно видеть на вставках к рис.3 из работы [12]. Тем не менее импульс излучения РЛ при максимальных значениях атомной концентрации (~3.3 × 10¹⁹ см⁻³) оказался достаточно интенсивным для регистрации.

Мы полагаем, что экспериментальная установка для генерации ультракороткого импульса излучения РЛ на Xe⁸⁺ должна формировать три импульса излучения Ті: сапфирового лазера. Первый импульс предназначен для накачки плазмы в потоке кластеров, второй должен проходить через линию задержки и использоваться для генерации ВГ, а третий должен проходить через вторую линию задержки для создания ультрабыстрого затвора, поглощающего остаточное излучение через ~1 пс после начала генерации РЛ. Для РЛ на Xe^{8+} с $\lambda = 41.8$ нм обычно используется алюминиевый фильтр – фольга толщиной 300-400 нм. Вторая линия задержки обеспечивает импульс излучения для ультрабыстрой ионизации (взрыва) внешней части фольги-фильтра, превращая ее в низкотемпературную плазму, поглощающую оставшуюся часть излучения из активной области плазмы. Современные линии задержки обеспечивают точность порядка нескольких фемтосекунд. (Например, линия задержки в эксперименте [13] выполнена с точностью 7 фс для синхронизации импульса излучения ВГ с началом генерации излучения РЛ.) Ультрабыстрый затвор обеспечивает резкий обрыв импульса РЛ.

Из экспериментов [20–23] следует, что плазма образуется в потоке кластеров сразу после ее взаимодействия с импульсом накачки. При высоких плотностях плазмы интенсивность излучения РЛ достигает максимума в течение нескольких сотен фемтосекунд (см. рис.3,*a*). Таким образом, в рассматриваемой схеме РЛ возможно получение импульса излучения с чрезвычайно крутым передним фронтом и отсутствием пьедестала. Такая форма импульса представляется перспективной для изучения сверхбыстрых процессов. Детальная схема экспериментальной установки будет представлена в одной из наших последующих работ.

- 1. Barty A. et al. Nat. Photonics, 2, 415 (2008).
- 2. Marchesini S. Nat. Photonics, 2, 560 (2008).
- 3. Klisnick A. et al. Phys. Rev. A, 65, 033810 (2002).
- 4. Zeitoun Ph. et al. Nature (London), 431, 426 (2004).
- Wang Y., Granados E., Larotonda M.A., Berrill M., Luther B.M., Patel D., Menoni C.S., Rocca J.J. Phys. Rev. Lett., 97, 123901 (2006).
- Wang Y., Granados E., Pedaci F., Alessi D., Luther B., Berril M., Rocca J.J. *Nat. Photonics*, 2, 94 (2008).
- 7. Hasegava N. et al. Phys. Rev. A, 76, 043805 (2007).
- 8. Pedaci F. et al. Opt. Lett., 33, 491 (2008).
- Wang Y., Berrill M., Pedaci F., Shakya M.M., Gilbertson S., Zenghu Chang, Granados E., Luther B.M., Larotonda M.A., Rocca J.J. *Phys. Rev. A*, **79**, 023810 (2009).
- Chou M.-C., Lin P.-H., Lin C.-A., Lin J.-Y., Wang J., Chen S.-Y. Phys. Rev. Lett., 99, 063904 (2007).
- Lin P.-H., Chou M.-C., Jiang M.-J., Tseng P.-C., Chu H.-H., Lin J.-Y., Wang J., Chen S.-Y. Opt. Lett., 34, 3562 (2009).
- Chu H.-H., Tsai H.-E., Chou M.-C., Yang L.-S., Lin J.-Y., Lee C.-H., Wang J., Chen S.-Y. *Phys. Rev. A*, 71, 061804 (2005).
- Mocek T., Sebban S., Maynard G., Zeitoun Ph., Faivre G., Hallou A., Fajardo M., Kazamias S., Cros B., Aubert D., de Lachèze-Murel G., Rousseau J.P., Dubau J. Phys. Rev. Lett., 95, 173902 (2005).
- 14. Ivanova E.P. Proc. 8th Int. Conf. on X-ray Lasers (Melville, NY, AIP, 2002).
- Иванова Е.П., Иванов А.Л. Квантовая электроника, 34, 1013 (2004).
- 16. Ivanova E.P. Phys. Rev. A, 84, 043829 (2011).
- 17. Ivanova E.P., Zinoviev A.N. Phys. Lett. A, 274, 239 (2000).
- Lemoff B.E., Yin G.Y., Gordon C.L. III, Barty C.P.J., Harris S.E. Phys. Rev. Lett., 74, 1574 (1995).
- 19. Sebban S. et al. Phys. Rev. Lett., 86, 3004 (2001).
- Ditmire T., Smith R.A., Tish W.G., Hutchinson M.H.R. *Phys. Rev.* A, 78, 3121 (1997).
- Shao Y.L., Ditmire T., Tisch J.W.G., Springate E., Marangos J.P., Hutchinson M.H.R. *Phys. Rev. Lett.*, 77, 3343 (1996).
- Ditmire T., Donelly T., Rubenchik A.M., Falcone R.W., Perry M.D. Phys. Rev. A, 53, 3379 (1996).
- Ter-Avetisyan S., Vogt U., Stiel H., Schnürer M., Will I., Nickles P.V. J. Appl. Phys., 94, 5489 (2003).
- 24. Hagena O.F., Obert W. J. Chem. Phys., 56, 1793 (1972).
- 25. Chen G., Kim B., Ahn B., Kim D.E. J. Appl. Phys., 106, 053507 (2009).
- Springate E., Hay N., Tisch J.W.G., Mason M.B., Ditmire T., Hutchinson M.H.R., Marangos J.P. *Phys. Rev. A*, 61, 063201 (2000).
- Döppner T., Fennel Th., Diederich Th., Tiggesbäumker J., Meiwes-Broer K.H. Phys. Rev. Lett., 94, 013401 (2005).